26	earch No	otes
	1 1 111 1 0111 1611 1	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/748,244	CHOI, MIN-SEOK	
Examiner	Art Unit	
Bussell D. Stermes	10047	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
301	124.1 127		
280	124.10	4	
	124.11		
	124.12	8	
	124.13	3	
	124.15	7	
267	2		
	64.11	5/13/05	233
<u>ر</u>	-	11	
Dest	TED	11/9650	8 3
U?2	451	4/27/00	
		!	

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	(A)		
			ļ

SEARCH! (INCLUDING SEAR	NOTES CH STRATEGY	n
	DATE	EXMR
•		
÷		
		-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+
		ŀ